

Шифр направления:
 Направление:
 Образовательная программа:
 Уровень: Магистр
 Нормативный срок освоения ООП: 2 года
 Форма обучения: Очная
 Стандарт ВО: СУОС

12.04.01
 Приборостроение
 Приборы и методы контроля качества и диагностики
 Условия освоения ООП: Полный срок
 Технология освоения ООП: Традиционная
 Фактический срок освоения ООП: 2 года

Одна зачетная единица: 36ч.

№ п/п	Индекс	Наименование дисциплин	Объем работы в часах и виды учебной нагрузки											Номер модуля/дисциплины	
			Всего часов	В т.ч. контактная работа	Аудиторная				Контактная			Самостоятельная работа	В т.ч. контактная работа по самостоятельной работе		В т.ч. контактная работа по промежуточной аттестации
					Всего часов	Лекции	Практикантия	Лаб. занятия	Контактная работа по лекции	Контактная работа по прак.	Контактная работа по лаб. занятиям				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Общая трудоемкость основной образовательной программы	4320	670.77	972	270	90	612	198	90	270	3348	83.70	29.07	
	Б1	Дисциплины (модули)	2160	670.77	972	270	90	612	198.00	90.00	270.00	1188	83.70	29.07	
1	Б1.Б	Обязательная часть	972	413.54					90.00	90.00	162.00		51.30	20.24	
2	М.1.1	История и методология науки и техники	108	41.65	36	36	0	0	36.00			72	5.40	0.25	1142546
3	1.1.1	История и методология науки и техники	108	41.65	36	36	0	0	36.00			72	5.40	0.25	1142547
4	М.1.2	Аналоговые и микропроцессорные устройства электронных приборов	324	134.86	108	36	0	72	36.00		72.00	216	16.20	10.66	
5	1.2.1	Проект по модулю Аналоговые и микропроцессорные устройства электронных приборов	36	6.00								36		6.00	
6	1.2.2	Микропроцессорные системы в науке и производстве	144	64.43	54	18	0	36	18.00		36.00	90	8.10	2.33	
7	1.2.3	Проектирование аналоговых электронных устройств	144	64.43	54	18	0	36	18.00		36.00	90	8.10	2.33	
8	М.1.3	Материалы и цифровые устройства электронной техники	252	110.00	90	0	0	90			90.00	162	13.50	6.50	
9	1.3.1	Проект по модулю Материалы и цифровые устройства электронной техники	36	6.00								36		6.00	
10	1.3.2	Компьютерное моделирование материалов и процессов	108	62.35	54	0	0	54			54.00	54	8.10	0.25	
11	1.3.3	Проектирование импульсных и цифровых устройств	108	41.65	36	0	0	36			36.00	72	5.40	0.25	
12	М.1.4	Поисковый анализ международных научных публикаций	180	85.38	72	0	72	0		72.00		108	10.80	2.58	1147534
13	1.4.1	Поисковый анализ международных научных публикаций	180	85.38	72	0	72	0		72.00		108	10.80	2.58	
14	М.1.5	Управление интеллектуальной собственностью	108	41.65	36	18	18	0	18.00	18.00		72	5.40	0.25	1142549
15	1.5.1	Управление интеллектуальной собственностью	108	41.65	36	18	18	0	18.00	18.00		72	5.40	0.25	1142548
16	Б1.В	Формируемая участниками образовательных отношений	1188	257.23					108.00		108.00		32.40	8.83	
17	М.1.6	Методы неразрушающего контроля и диагностики	432	257.23	216	108	0	108	108.00		108.00	216	32.40	8.83	1147344
18	1.6.1	Проект по модулю Методы неразрушающего контроля и диагностики	36	6.00								36		6.00	

19	1.6.2	Актуальные проблемы неразрушающего контроля и диагностики	144	85.13	72	36	0	36	36.00		36.00	72	10.80	2.33	
20	1.6.3	Акустический контроль и диагностика	144	83.05	72	36	0	36	36.00		36.00	72	10.80	0.25	
21	1.6.4	Вихретоковый контроль и диагностика	108	83.05	72	36	0	36	36.00		36.00	36	10.80	0.25	
22	Б1.В.ВВ	По выбору студента	756		414	72	0	342				342			
23	М.1.7	Методы научных исследований в неразрушающем контроле	432	255.15	216	0	0	216			216.00	216	32.40	6.75	1147348
24	1.7.1	Проект по модулю Методы научных исследований в неразрушающем контроле	36	6.00								36		6.00	
25	1.7.2	Учебно-исследовательская деятельность в приборостроении	396	249.15	216	0	0	216			216.00	180	32.40	0.75	
26	М.1.8	Методы научных исследований в электронике	432	255.15	216	0	0	216			216.00	216	32.40	6.75	
27	1.8.1	Проект по модулю Методы научных исследований в электронике	36	6.00								36		6.00	
28	1.8.2	Учебно-исследовательская деятельность в электронике	396	249.15	216	0	0	216			216.00	180	32.40	0.75	
29	М.1.9	Методы получения и свойства наноматериалов	324	232.61	198	72	0	126	72.00		126.00	126	29.70	4.91	1142585
30	1.9.1	Радиационные технологии создания наноразмерных структур	108	85.13	72	36	0	36	36.00		36.00	36	10.80	2.33	1132892
31	1.9.2	Спецпрактикум "Методы получения и исследования свойств наноразмерных материалов"	108	62.35	54	0	0	54			54.00	54	8.10	0.25	1132893
32	1.9.3	Функциональные материалы микро- и нанoeлектроники	108	85.13	72	36	0	36	36.00		36.00	36	10.80	2.33	1132887
33	М.1.10	Технологии неразрушающего контроля и диагностики	324	232.61	198	72	0	126	72.00		126.00	126	29.70	4.91	1142587
34	1.10.1	Радиационный контроль и диагностика	108	85.13	72	36	0	36	36.00		36.00	36	10.80	2.33	
35	1.10.2	Спецпрактикум "Физические основы контроля и диагностики материалов и изделий"	108	62.35	54	0	0	54			54.00	54	8.10	0.25	
36	1.10.3	Электрический и магнитный контроль	108	85.13	72	36	0	36	36.00		36.00	36	10.80	2.33	
	Б2	Практика	1944		0	0	0	0				1944			
37	Б2.Б	Обязательная часть	1944												
38	М.2.1	Учебная практика, производственно-технологическая	216		0	0	0	0				216			1147340
39	2.1.1	Учебная практика, производственно-технологическая	216		0	0	0	0				216			
40	М.2.2	Производственная практика, научно-исследовательская работа	864		0	0	0	0				864			1147341
41	2.2.1	Производственная практика, научно-исследовательская работа	864		0	0	0	0				864			
42	М.2.3	Производственная практика, преддипломная	864		0	0	0	0				864			1147342
43	2.3.1	Производственная практика, преддипломная	864		0	0	0	0				864			
	Б3	Государственная итоговая аттестация	216		0	0	0	0				216			
44	Б3.Б	Обязательная часть	216												
45	М.3.1	Государственная итоговая аттестация	216		0	0	0	0				216			
46	3.1.1	Подготовка к защите и процедура защиты выпускной квалификационной работы	216		0	0	0	0				216			
	Б4	Факультативы	216	50.10	44	12	32	0	11.88	31.68		172	6.54		
47	Б4.В	Формируемая участниками образовательных отношений	216	50.10					11.88	31.68			6.54		
48	М.4.1	Адаптационный модуль для лиц с ограниченными возможностями здоровья	216	50.10	44	12	32	0	11.88	31.68		172	6.54		
49	4.1.1	Основы личностного роста	108	25.05	22	6	16	0	5.94	15.84		86	3.27		
50	4.1.2	Развитие ресурсов организма	108	25.05	22	6	16	0	5.94	15.84		86	3.27		